

信頼性試験結果

Reliability Test

XC8110 シリーズ

XC8110 Series

パッケージ

Package

USP-6B06

RoHS対応品 / RoHS Compliance

ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=6.3V, CE=6.3V	1000	0/22
2	高温逆バイアス High Temperature Reverse Bias	125°C VOUT=6.3V, CE=6.3V	1000	0/22
3	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
4	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=6.3V	1000	0/22
5	温度サイクル Temperature Cycle	-65°C~150°C 各30分 30min each	100CYC.	0/22
6	プレッシャークッカーバイアス HAST	130°C85%RH 2×10^5 Pa, VIN=6.3V	100	0/22
7	プレッシャークッカー UHAST	130°C85%RH 2×10^5 Pa	100	0/22
8	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020	-	0/22
9	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM R=0Ω C=200pF ±200V	3回 3 times	0/5
		HBM R=1500Ω C=100pF ±1kV	3回 3 times	0/5
		CDM ±500V	3回 3 times	0/5
10	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V	1回 1 time	0/5
		±50mA	1回 1 time	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	接合強度試験 Adhesive Strength Test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.	0/5
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回 (EIAJ ED4702) Strain 5mm 5±1s 1time (EIAJ ED4702)	0/5
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒 (プロファイル昇温法) 230°C 10s (Temperature profile method)	0/11